# СУБВОЛНОВЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СОЛИТОНЫ В НЕОДНОРОДНЫХ КУБИЧНО-НЕЛИНЕЙНЫХ СРЕДАХ

В. А. Алешкевич<sup>а</sup>, А. В. Григорьев<sup>а</sup>, А. С. Жукарев<sup>а</sup>, Я. В. Карташов<sup>b\*</sup>

<sup>а</sup> Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 119899, Москва, Россия

<sup>b</sup> ICFO-Institut de Ciencies Fotoniques, Mediterranean Technology Park, and Universitat Politecnica de Catalunya 08860, Castelldefels, Barcelona, Spain

Поступила в редакцию 25 декабря 2007 г.

Проведено исследование распространения узких волновых пучков в кубично-нелинейной среде с периодической пространственной модуляцией показателя преломления при произвольном соотношении ширины пучка, периода модуляции и длины световой волны. Из уравнений Максвелла получены решения, описывающие распространение световых пучков в виде пространственных солитонов и установлены их основные свойства. Проведено сравнение полученных результатов с выводами, вытекающими из решения параксиального нелинейного уравнения Шредингера и определены условия, при которых оба подхода неадекватны друг другу.

PACS: 42.65.Tg

## 1. ВВЕДЕНИЕ

Одним из наиболее эффективных приближений, использующихся при анализе распространения интенсивного лазерного излучения в нелинейной среде, является параксиальное приближение (см. монографии [1–4] и ссылки в них). Оно позволяет вывести скалярное нелинейное уравнение Шредингера, описывающее эволюцию световых пучков, ширина которых существенно превосходит длину волны излучения. Данное уравнение, в частности, допускает солитонные решения, описывающие распространение пучков при взаимной компенсации дифракционного расплывания и нелинейного самовоздействия.

Однако когда ширина пучка становится сравнимой с длиной волны, параксиальное приближение становится некорректным. В частности, теория самофокусировки на основе уравнения Шредингера предсказывает коллапс излучения, что не находит убедительного экспериментального подтверждения.

Для анализа распространения непараксиальных световых пучков в нелинейной среде авторами работ [5–7] в скалярное уравнение Шредингера добавлялись несколько членов, описывающих малые непараксиальные поправки, связанные с дифракцией и нелинейностями высших порядков.

Однако наиболее последовательный и корректный анализ такой задачи может быть проведен лишь на основе решения системы уравнений Максвелла с учетом векторного взаимодействия между поперечной и продольной компонентами светового поля. Последняя в случае непараксиальных пучков уже не является пренебрежимо малой [8–14].

В цитируемых работах рассматривались лишь непараксиальные световые пучки в однородной нелинейной среде. В связи с широким использованием в современной оптике решеток показателя преломления, фотонных кристаллов и пр. становится актуальной задача исследования распространения световых пучков в средах с пространственной модуляцией показателя преломления. Хорошо известно, что уже в линейной неоднородной среде необходим учет продольной компоненты светового поля, если масштаб неоднородности становится сравнимым с длиной световой волны. Ситуация значительно усложняется в нелинейной среде, в которой одновременно происходит как линейная, так и нелинейная рефракция.

<sup>\*</sup>E-mail: Yaroslav.Kartashov@icfo.es

## 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Для решения поставленной задачи воспользуемся системой уравнений Максвелла

$$\operatorname{rot} \mathbf{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}, \quad \operatorname{div} \mathbf{D} = 0,$$
  
$$\operatorname{rot} \mathbf{H} = \frac{1}{c} \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad \operatorname{div} \mathbf{H} = 0,$$
(1)

которая дополняется материальным уравнением

$$\mathbf{D} = (\varepsilon_0 + \varepsilon_{nl+mod}) \mathbf{E},$$

где  $\varepsilon_0$  описывает пространственно-однородную часть диэлектрической проницаемости изотропной среды, а  $\varepsilon_{nl+mod}$  учитывает как кубичную нелинейность керровского типа, так и модуляцию линейного показателя преломления среды.

Уравнение div  $\mathbf{D} = 0$  может быть записано в виде

$$\operatorname{div} \mathbf{E} = -\frac{1}{\varepsilon_0} \operatorname{div}(\varepsilon_{nl+mod} \mathbf{E}).$$
(2)

Комбинируя это уравнение с уравнением

rot rot 
$$\mathbf{E} = -(1/c^2) \partial^2 \mathbf{D} / \partial t^2$$
,

следующим из системы уравнений Максвелла, и полагая, что электрическое поле изменяется во времени по гармоническому закону  $\mathbf{E} \sim \mathbf{A} \exp(-i\omega t)$ , приходим к модифицированному волновому уравнению:

$$-\frac{1}{\varepsilon_0} \operatorname{grad} \operatorname{div}(\varepsilon_{nl+mod} \mathbf{A}) - \Delta \mathbf{A} =$$
$$= \frac{\omega^2}{c^2} (\varepsilon_0 + \varepsilon_{nl+mod}) \mathbf{A}. \quad (3)$$

Здесь  $\Delta = \partial^2 / \partial x^2 + \partial^2 / \partial y^2 + \partial^2 / \partial z^2$  — полный трехмерный лапласиан. В дальнейшем мы предполагаем, что световой пучок распространяется в направлении оси z, а напряженность электрического поля зависит лишь от одной поперечной координаты x, вдоль которой осуществлена периодическая модуляция диэлектрической проницаемости. Тогда, представив вектор напряженности светового поля в виде

$$\mathbf{A} = \mathbf{e}_x A_x(x, z) + \mathbf{e}_z A_z(x, z),$$

где  $\mathbf{e}_x$ ,  $\mathbf{e}_z$  — единичные векторы вдоль соответствующих осей,  $A_{x,z}$  — соответствующие компоненты амплитуды светового поля, и подставив в уравнение (3), получим систему уравнений:

$$-\frac{1}{\varepsilon_{0}} \left[ \frac{\partial^{2}}{\partial x^{2}} (\varepsilon_{nl+mod} A_{x}) + \frac{\partial^{2}}{\partial x \partial z} (\varepsilon_{nl+mod} A_{z}) \right] - \Delta A_{x} =$$

$$= \frac{\omega^{2}}{c^{2}} (\varepsilon_{0} A_{x} + \varepsilon_{nl+mod} A_{x}),$$

$$-\frac{1}{\varepsilon_{0}} \left[ \frac{\partial^{2}}{\partial x \partial z} (\varepsilon_{nl+mod} A_{x}) + \frac{\partial^{2}}{\partial z^{2}} (\varepsilon_{nl+mod} A_{z}) \right] - \Delta A_{z} =$$

$$= \frac{\omega^{2}}{c^{2}} (\varepsilon_{0} A_{z} + \varepsilon_{nl+mod} A_{z}),$$
(4)

где

$$\varepsilon_{nl+mod} = \varepsilon_2(|A_x|^2 + |A_z|^2) + \varepsilon_{mod}R(x),$$

 $\varepsilon_2$  — нелинейный коэффициент,  $\varepsilon_{mod}$  — глубина модуляции диэлектрической проницаемости, функция  $R(x) = \cos(2\pi x/d) = \cos(\Omega_0 x)$ , d и  $\Omega_0$  — соответственно период и частота пространственной модуляции. Надо отметить, что используемое нами выражение для нелинейной добавки к диэлектрической проницаемости изотропной среды оправдано, если вектор напряженности электрического поля не изменяет направление (в общем случае необходим учет нелинейных поляризационных эффектов).

Данную систему уравнений удобно переписать в безразмерном виде:

$$-\left\{\frac{\partial^{2}}{\partial\eta^{2}}\left[pRq_{x}+\sigma q_{x}\left(|q_{x}|^{2}+|q_{z}|^{2}\right)\right]+\right.$$

$$+\delta\frac{\partial^{2}}{\partial\eta\partial\xi}\left[pRq_{z}+\sigma q_{z}\left(|q_{x}|^{2}+|q_{z}|^{2}\right)\right]\right\}=$$

$$=\frac{\partial^{2}q_{x}}{\partial\eta^{2}}+\delta^{2}\frac{\partial^{2}q_{x}}{\partial\xi^{2}}+\frac{1}{\delta^{2}}q_{x}+$$

$$+\frac{1}{\delta^{2}}\left[pRq_{x}+\sigma q_{x}\left(|q_{x}|^{2}+|q_{z}|^{2}\right)\right],$$

$$-\left\{\delta\frac{\partial^{2}}{\partial\eta\partial\xi}\left[pRq_{z}+\sigma q_{z}\left(|q_{x}|^{2}+|q_{z}|^{2}\right)\right]+$$

$$+\delta^{2}\frac{\partial^{2}}{\partial\xi^{2}}\left[pRq_{z}+\sigma q_{z}\left(|q_{x}|^{2}+|q_{z}|^{2}\right)\right]\right\}=$$

$$=\frac{\partial^{2}q_{z}}{\partial\eta^{2}}+\delta^{2}\frac{\partial^{2}q_{z}}{\partial\xi^{2}}+\frac{1}{\delta^{2}}q_{z}+$$

$$+\frac{1}{\delta^{2}}\left[pRq_{z}+\sigma q_{z}\left(|q_{x}|^{2}+|q_{z}|^{2}\right)\right].$$
(5)

Здесь поперечная координата  $\eta = x/x_0$  нормирована на характерную ширину  $x_0$ ; продольная координата  $\xi = z/L_{dif}$  нормирована на соответствующую дифракционную длину  $L_{dif} = k_0 x_0^2$ ;  $k_0 = \omega \varepsilon_0^{1/2}/c$  — волновое число;  $\delta = 1/k_0 x_0$  — параметр непараксиальности, который характеризует соотношение длины волны и ширины  $x_0$ ;  $q_{x,z} = A_{x,z}A_0^{-1}$  — компоненты безразмерной амплитуды светового поля;  $A_0$  характерная амплитуда светового поля; параметр  $\sigma = \varepsilon_2 A_0^2/\varepsilon_0$  определяет степень нелинейности отклика среды;  $p = \varepsilon_{mod}/\varepsilon_0$  — параметр, характеризующий глубину модуляции показателя преломления;  $R(\eta) = \cos(\Omega \eta)$ , где  $\Omega = \Omega_0 x_0$  — безразмерная пространственная частота.

Как показывают оценки, аналогичные проведенным в работах [8–14], в однородной среде или в случае большого периода модуляции ( $d \gg x_0$ ) величина продольной компоненты поля

$$q_z \approx \frac{i}{k_0} \frac{\partial q_x}{\partial x} \tag{6}$$

или, что эквивалентно,  $q_z/q_x \sim \delta$ .

В среде с пространственной модуляцией диэлектрической проницаемости, когда  $d \leq x_0$ , оценка (6) становится некорректной. Действительно, в случае поляризованной в плоскости xz плоской волны из уравнения div  $\mathbf{D} = 0$  получается оценка  $\partial A_x / \partial x \sim A_x \varepsilon_{mod} / \varepsilon_0 d$ . При ее подстановке в (6) получаем  $q_z/q_x \sim \varepsilon_{mod} \lambda/2\pi\varepsilon_0 d$ .

С другой стороны, появление продольной компоненты поля связано с наличием в уравнении (3) первого слагаемого в левой части, которое в среде с модуляцией диэлектрической проницаемости по порядку величины в  $\lambda \varepsilon_{mod}/\varepsilon_0 d$  раз больше второго. Соответственно, и  $q_z/q_x \sim \varepsilon_{mod}\lambda/\varepsilon_0 d$ , что отличается множителем  $1/2\pi$  от оценки (6).

В общем случае пучка произвольной ширины и среды с произвольным периодом модуляции диэлектрической проницаемости для продольной компоненты светового поля справедлива обобщенная оценка

$$\frac{q_z}{q_x} \sim \max\left(\frac{\lambda \varepsilon_{mod}}{\varepsilon_0 d}, \frac{\lambda}{2\pi x_0}\right) = \max(\Omega \delta p, \delta). \quad (7)$$

## 3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Будем искать решение системы уравнений (5) в виде

$$q_x(\eta,\xi) = w_x(\eta) \exp\left[i(1+b)\xi/\delta^2\right], q_z(\eta,\xi) = iw_z(\eta) \exp\left[i(1+b)\xi/\delta^2\right],$$
(8)

где  $w_{x,z}$  — действительные функции, описывающие поперечные распределения светового поля, b — постоянная распространения, характеризующая нелинейный фазовый набег, приобретаемый световым пучком при распространении в среде. Фазовый сдвиг, равный  $\pi/2$ , между компонентами  $q_x$  и  $q_z$  согласуется с оценочным выражением (6), полученным в параксиальном приближении. Из оценки (6) следует, что для симметричного профиля x-компоненты поля профиль z-компоненты будет антисимметричным.

Профили непараксиальных солитонов определялись численно, с помощью метода релаксации. Параметр нелинейности положим равным  $\sigma = 0.01$ . Последние исследования показали, что некоторые из материалов позволяют достичь значительно больших нелинейных добавок к диэлектрической проницаемости, вплоть до  $\sigma = \varepsilon_2 A_0^2/\varepsilon_0 = 0.1$  [15,16]. В процессе вычислений варьировались параметры  $\delta$ ,  $p, \Omega, b$ .

Характерные профили фундаментальных непараксиальных решеточных солитонов (в среде с решеткой показателя преломления) представлены на рис. 1*a*-*6*. Видно, что поперечная компонента поля является симметричной, в то время как продольная компонента всегда антисимметрична относительно оси пучка.

В том случае, когда постоянная распространения, уменьшаясь, приближается к определенной отсечке (эта отсечка зависит только от частоты решетки, ее профиля, и глубины), солитон становится очень широким, и его профиль приобретает множественные осцилляции (рис. 1*a*). Положение каждого из локальных максимумов поперечной компоненты поля приблизительно совпадает с положениями локальных максимумов решетки показателя преломления, в то время как продольная компонента поля, как правило, обращается в нуль в этой точке.

Наоборот, увеличение постоянной распространения приводит к пространственной локализации обеих компонент светового поля (рис. 16), и затем поле практически полностью концентрируется в одном канале решетки (рис. 1e), так что пространственные осцилляции профиля становятся неразличимыми. Амплитуда продольной компоненты поля существенно возрастает, а ширина солитона уменьшается. В последнем случае (рис. 1e) нелинейные эффекты доминируют над «решеточными», поэтому решеточный солитон становится похожим на непараксиальный солитон в однородной среде.

Для сравнения на рис. 2 показаны профили непараксиальных солитонов в однородной среде при том же значении параметра непараксиальности  $\delta$ , что и на рис. 1. Широкий солитон (рис. 2a) имеет весьма малую продольную компоненту поля, а его профиль



Рис. 1. Профили непараксиальных решеточных солитонов при b = 0.0368 (*a*), 0.04 (*б*), 0.07 (*в*). Профили параксиальных солитонов при b = 0.0436 (*г*), 0.04325 (*d*), 0.0469 (*е*). Солитон с рис. *г* имеет такую же мощность, как солитон с рис. *a*, в то время как солитон с рис. *d* имеет такую же ширину, как солитон с рис. *a*. Солитон с рис. *e* имеет такую же мощность, как непараксиальный солитон с рис. *б*. Параметр непараксиальности  $\delta = 0.1$ , глубина решетки p = 0.2, частота решетки  $\Omega = 4$ 

хорошо описывается sech-функцией, как и для параксиального солитона.

Из сравнения профилей солитонов на рис. 1, 2 можно сделать два важных вывода. Во-первых, наличие сильной периодической решетки показателя преломления приводит к значительному уменьшению интегральной ширины солитона, определяемой как

$$W = \left( U^{-1} \int_{-\infty}^{\infty} \eta^2 (w_x^2 + w_z^2) \, d\eta \right)^{1/2}, \qquad (9)$$

где

$$U = U_x + U_z = \int_{-\infty}^{\infty} (w_x^2 + w_z^2) \, d\eta$$
 (10)

– мощность пучка. Это становится особенно за-



Рис.2. Профили непараксиальных солитонов в однородной нелинейной среде, соответствующие b = 0.00019 (a), 0.001 (b), 0.01107 (c) при  $\delta = 0.1$ . Солитоны, изображенные на рис. a и b, соответствуют тем же значениям мощности, что и решеточные солитоны, изображенные на рис. 1b и 1b. Солитон, показанный на рис. b, имеет такую же ширину, как решеточный солитон, показанный на рис. 1a



Рис.3. Интегральная ширина солитона как функция постоянной распространения при следующих значениях:  $a - p = 0.2, \Omega = 2$  (1), 16 (2),  $\delta - \Omega = 4, p = 0.2$  (1), 0.8 (2). Во всех случаях  $\delta = 0.3$ 

метным при сравнении профилей солитонов, соответствующих одинаковым значениям мощности U. Сравнение, например, рис. 16 и рис. 2a при U = 0.783 или рис. 1a и рис. 2a при U = 6.098 показывает, что в обоих случаях ширина солитона при наличии решетки оказывается намного меньше ширины солитона с той же мощностью в однородной среде. Во-вторых, решеточный солитон, показанный на рис. 1a, обладает существенно большей продольной компонентой поля, чем его аналог с такой же шириной в однородной нелинейной среде, изображенный на рис. 26. Все это указывает на то, что условия каналирования энергии в средах с пространственной модуляцией показателя преломления оказываются предпочтительнее, чем в однородных средах.

Необходимо отметить, что для низкоамплитудных солитонов, накрывающих много периодов решетки, появление продольной компоненты обусловлено главным образом наличием решетки. В этом случае, согласно (7),

$$q_z/q_x \sim \Omega \delta p. \tag{11}$$

Наоборот, при высоких мощностях появление продольной компоненты поля в основном связано с общей сильной нелинейной локализацией светового пучка в единственном канале решетки. Поскольку в нем безразмерная ширина пучка W < 1, имеем

$$q_z/q_x \sim \lambda/2\pi W x_0 > \delta. \tag{12}$$

На рис. З показаны зависимости ширины солитона от постоянной распространения. Хорошо видно, что с увеличением b (а, значит, и мощности U) ширина пучка, уменьшаясь, стремится к определенно-



Рис. 4. Мощность (a) и интегральная ширина ( $\delta$ ) солитона как функции постоянной распространения при p = 0.2,  $\delta = 0.1$ . Кривые, помеченные символом «p», получены в параксиальном приближении с помощью скалярного уравнения Шредингера; кривые, помеченные «n», вычислены с помощью системы непараксиальных уравнений (5). e -Отсечка по постоянной распространения как функция глубины решетки при  $\delta = 0.1$ . Во всех случаях частота решетки  $\Omega = 4$ 

му пределу, который слабо зависит как от пространственной частоты  $\Omega$  (рис. 3a), так и от глубины модуляции показателя преломления p (рис. 3b). Это связано с тем, что при больших мощностях нелинейная рефракция доминирует над линейной и пространственная решетка оказывает слабое влияние на формирование солитона. При  $\delta = 0.3$  характерная ширина  $x_0 \approx \lambda/2$  ( $\lambda$  — длина волны в среде). С ростом постоянной распространения ширина солитона стремится к величине  $W_{min} = 1/2$ , что приблизительно соответствует четверти длины волны, согласно результатам, полученным в работе [10] для однородной нелинейной среды.

С практической точки зрения представляет интерес сравнить характеристики солитонов, полученных как с помощью уравнений Максвелла, так и с использованием параксиального приближения на основе нелинейного уравнения Шредингера. Это позволит установить границы области применимости широко используемого параксиального приближения к задачам распространения узких световых пучков в средах с кубичной нелинейностью.

Прежде всего отметим, что члены, сосредоточенные в левых частях уравнений (5), появляются из-за учета непараксиальных эффектов. Они становятся пренебрежимо малыми при  $\delta = \lambda/2\pi x_0 \ll 1$  и для частот модуляции показателя преломления, для которых  $\Omega \delta = \lambda/d \ll 1$ .

При выполнении обоих неравенств система уравнений (5) может быть сведена к системе стандартных параксиальных нелинейных уравнений Шредингера заменой  $q_{x,z} \sim q_{x,z}^s \exp(i\xi/\delta^2)$ , где  $q_{x,z}^s - q_{x,z}^s$ 

медленно меняющиеся функции продольной координаты. Действительно, полагая левые части уравнений (5) равными нулю, затем вычисляя в правых частях величины

$$\delta^2 \frac{\partial^2 q_{x,z}}{\partial \xi^2} = \left( \delta^2 \frac{\partial^2 q_{x,z}^s}{\partial \xi^2} + 2i \frac{\partial q_{x,z}^s}{\partial \xi} - \frac{q_{x,z}^s}{\delta^2} \right) \exp \frac{i\xi}{\delta^2}$$

и в силу малости δ пренебрегая первым слагаемым в круглых скобках, получаем

$$2i\frac{\partial q_x^s}{\partial \xi} + \frac{\partial^2 q_x^s}{\partial \eta^2} + \frac{1}{\delta^2} \left[ pRq_x^s + \sigma q_x^s \left( |q_x^s|^2 + |q_z^s|^2 \right) \right] = 0,$$

$$2i\frac{\partial q_z^s}{\partial \xi} + \frac{\partial^2 q_z^s}{\partial \eta^2} + \frac{1}{\delta^2} \left[ pRq_z^s + \sigma q_z^s \left( |q_x^s|^2 + |q_z^s|^2 \right) \right] = 0.$$
(13)

Теперь используем параксиальное приближение и определим профили решеточных солитонов с помощью первого уравнения (13) для поперечной компоненты электрического поля волны. Такие профили показаны на рис. 1*e*-*e*. Хорошо видно, что профиль маломощного параксиального солитона с рис. 1*e* значительно у́же, чем профиль непараксиального солитона с рис. 1*a* той же мощности. В то же время, параксиальный солитон с рис. 1*d* с такой же шириной, как у непараксиального солитона с рис. 1*a*, обладает меньшей мощностью. С увеличением мощности солитонов (ср. рис. 1*б*и 1*e*) разница в их ширинах становится меньше.

Установлено, что мощность непараксиального решеточного солитона является монотонно нарастаю-

<sup>13</sup> ЖЭТФ, вып. 1 (7)



Рис.5. Обратная ширина солитона как функция его мощности в однородной нелинейной среде (a) и при наличии периодической решетки показателя преломления с p = 0.2,  $\Omega = 4$  (б). Кривые, помеченные символом «p», получены в параксиальном приближении с помощью скалярного уравнения Шредингера; кривые, помеченные символом «n», вычислены с помощью системы уравнений (5). e — Отношение мощностей продольной и поперечной компонент поля как функция полной мощности для  $\Omega = 0$  (1), 2 (2), 3 (3) при p = 0.2. Во всех случаях  $\delta = 0.1$ 

щей функцией постоянной распространения b, поэтому dU/db > 0 (рис. 4a). Это дает основание предположить устойчивость всей ветви, хотя, разумеется, нельзя однозначно утверждать, что критерий Вахитова – Колоколова в этом случае может быть использован.

Мощность солитона обращается в нуль при значении  $b = b_{co}$ , называемом отсечкой по постоянной распространения. При фиксированной глубине решетки отсечка оказывается несколько меньше для непараксиальных солитонов, чем для их параксиальных решеточных аналогов (ср. кривые, помеченные «p» и «n» на рис. 4a).

Для маломощных (широких) солитонов величина W быстро уменьшается с ростом постоянной распространения b (см. рис. 3, 4b), при этом, как отмечалось выше, при одинаковой мощности параксиальный солитон значительно у́же непараксиального. У мощных солитонов, для которых  $b \gg b_{co}$ , их ширина W медленно убывает с увеличением U.

Таким образом, в области  $0 < b < b_0$  (в нашем случае характерная постоянная распространения  $b_0 \approx 0.05$ ) эти два подхода дают сильно различающиеся результаты по ширине W при приблизительно одинаковой мощности пучков. В области  $b > b_0$ это различие в ширинах при одинаковом b невелико. Однако мощность непараксиального пучка заметно превышает мощность параксиального пучка вследствие появления продольной компоненты поля. Значение  $b_0$  приблизительно вдвое превышает отсечку  $b_{co}$ . Эта величина, в свою очередь, монотонно возрастает с увеличением глубины модуляции решетки (рис. 4в).

Основные результаты данной работы проиллюстрированы на рис. 5, где изображены зависимости обратной ширины солитона  $W^{-1}$  от мощности U для параксиальной и непараксиальной моделей. Хорошо известно, что в отсутствие решетки ширина параксиального солитона, описываемого кубичным уравнением Шредингера, обратно пропорциональна его мощности. Поэтому соответствующая зависимость  $W^{-1}(U)$ , показанная на рис. 5*a*, является линейной.

Однако при учете непараксиальных эффектов ширина непараксиального солитона с той же самой мощностью оказывается несколько большей, чем ширина параксиального солитона. Это происходит из-за появления продольной компоненты поля, которая с увеличением мощности становится все более четко выраженной. Вследствие этого, разница между зависимостями  $W^{-1}(U)$  для параксиальных и непараксиальных солитонов увеличивается с ростом U (рис. 5*a*).

Данная картина заметно меняется при наличии периодической решетки показателя преломления (рис. 56). Продольная компонента поля в решетке может быть весьма значительной даже при малых мощностях, когда ширина солитона достаточно велика. В этом случае сама решетка приводит к появлению мелкомасштабных осцилляций на профиле широкого солитона (рис. 1*a*). Поэтому кривые  $W^{-1}(U)$  для параксиальных и непараксиальных солитонов начинают заметно различаться при существенно меньших значениях мощности, чем в однородной нелинейной среде.

Подобное различие становится еще более заметным с увеличением частоты  $\Omega$  пространственной модуляции показателя преломления и параметра непараксиальности  $\delta$ , поскольку, в соответствии с формулой (11), возрастает продольная компонента светового поля.

Таким образом, применимость параксиального приближения напрямую связана с относительным вкладом продольной компоненты, величина которой может быть оценена соотношением (7). Последнее утверждение наглядно проиллюстрировано на рис. 5*в*, на котором показаны зависимости соотношения мощностей  $S = U_z/U_x$ , сосредоточенных в продольной и поперечной компонентах, от полной мощности солитона.

Очевидно, что для параксиального приближения  $S \equiv 0$ . В отсутствие решетки ( $\Omega = 0$ ) продольная компонента исчезает при  $U \to 0$  (солитон становится очень широким) и монотонно растет с увеличением U. Чем больше величина S, тем хуже соответствие между параксиальным и непараксиальным подходами, поскольку с ростом S возрастает и различие между кривыми  $W^{-1}(U)$ , характеризующими связь между параметрами солитона.

По мере увеличения частоты решетки соотношение мощностей продольной и поперечной компонент становится отличным от нуля даже при  $U \rightarrow 0$ . Это свидетельствует о том, что при малых мощностях «решеточные» эффекты доминируют над нелинейными, и увеличение частоты решетки приводит к возрастанию относительной мощности продольной компоненты поля. Однако с увеличением полной мощности U относительное влияние решетки становится все слабее, и кривые S(U) для разных пространственных частот постепенно сближаются.

## 4. ВЫВОДЫ

В нелинейных средах с периодической модуляцией показателя преломления возможно формирование пространственных солитонов, в ряде случаев обладающих значительной продольной компонентой светового поля. Одновременное проявление линейной и нелинейной рефракции может приводить к значительным уменьшениям интегральной ширины солитона (по сравнению с однородной средой). Параксиальное приближение может приводить к существенным погрешностям как при сильной нелинейной рефракции, когда ширина солитона приближается к длине волны, так и в случае широких солитонов в мелкомасштабных решетках показателя преломления.

## ЛИТЕРАТУРА

- Э. Инфельд, Дж. Роуландс, Нелинейные волны, солитоны и хаос, Физматлит, Москва (2005) [E. Infeld and G. Rowlands, Nonlinear Waves, Solitons, and Chaos, Cambridge Univ. Press, Cambridge (1990)].
- Н. Н. Ахмедиев, А. Анкевич, Солитоны: нелинейные импульсы и пучки, Физматлит, Москва (2003) [N. N. Akhmediev and A. Ankiewicz, Solitons: Nonlinear Pulses and Beams, Chapman & Hall, London (1997)].
- Ю. С. Кившарь, Г. П. Агравал, Оптические солитоны. От волоконных световодов до фотонных кристаллов, Физматлит, Москва (2005) [Y. Kivshar and G. Agrawal, Optical Solitons: From Fibers to Photonic Crystals, Acad. Press, London (2003).
- M. J. Ablowitz, B. Prinari, and A. D. Trubatch, Discrete and Continuous Nonlinear Schroedinger Systems, Cambridge Univ. Press, Cambridge (2004).
- M. D. Feit and J. A. Fleck, Jr., J. Opt. Soc. Amer. B 5, 633 (1988).
- S. Blair and K. Wagner, Opt. Quant. Electron. 30, 697 (1998).
- 7. Н. Н. Розанов, Опт. и спектр. 94, 1013 (2003).
- 8. S. Chi and Q. Guo, Opt. Lett. 20, 1598 (1995).
- B. Crosignany, P. Di Porto, and A. Yariv, Opt. Lett. 22, 778 (1997).
- 10. E. Granot et al., Opt. Lett. 22, 1290 (1997).
- Н. Н. Розанов, Н. В. Высотина, А. Г. Владимиров, ЖЭТФ 118, 1307 (2000).
- 12. R. de la Fuente et al., Opt. Comm. 173, 403 (2000).
- N. N. Rosanov, V. E. Semenov, and N. V. Vyssotina, J. Opt. B: Quantum Semiclass. Opt. 3, S96 (2001).
- 14. A. Ciattoni et al., Opt. Lett. 27, 734 (2002).
- 15. L. Brzozowski et al., Appl. Phys. Lett. 82, 4429 (2003).
- 16. A. M. Akulshin et al., J. Opt. B: Quantum Semiclass. Opt. 6, 491 (2004).